

BACK-END

MOS-FET

IGBT

DIODE

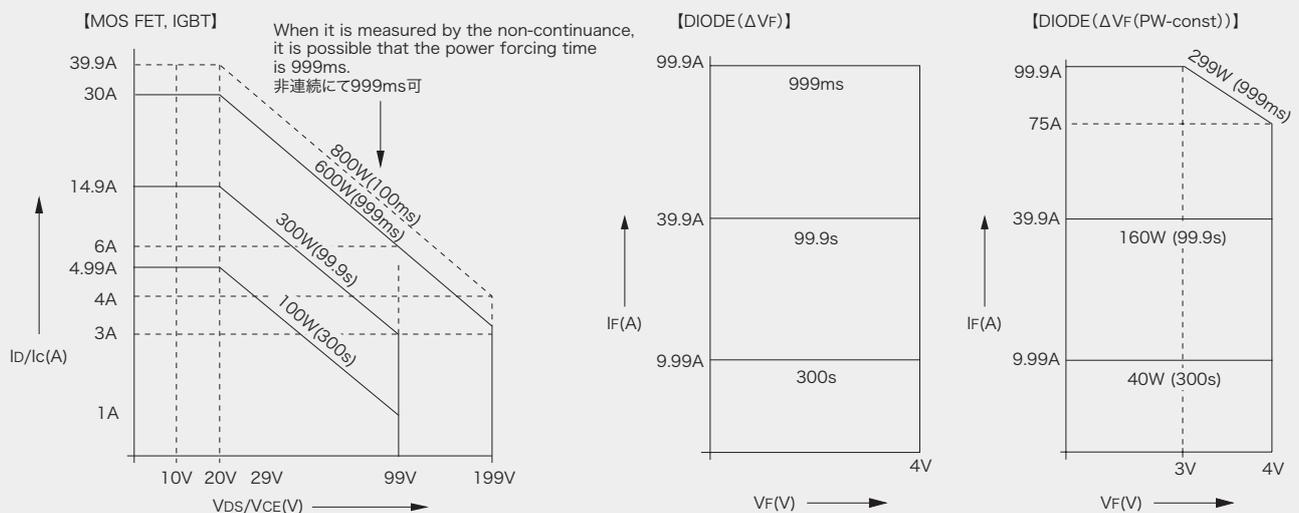
THERMAL RESISTANCE TESTER 過渡熱抵抗測定器

DVTH210Z 200V
100A

- DVTH210Z is the 100A version of the DVTH series, the new flagship of thermal resistance tester.
It enables long-time measurement in the 100W-300sec line. Safety cover is equipped with an air-cooled heat sink. It contains a diode power contact test function to enable constant power measurements during diode measuring.
- 過渡熱抵抗測定器の新たな主力機である DVTH シリーズの 100A 仕様版です。100W-300sec ラインでの長時間測定を可能としています。また安全カバーには空冷ヒートシンクが装備されています。ダイオード測定時、電力一定での測定を可能とするダイオードパワーコンタクト測定機能付き。



Forcing Power Range Diagram



MODEL

DVTH210Z

MEASUREMENT RANGE

V_{SD1}/V_{GE1}/V_{CE1}/V_{F1}

0000mV~9999mV

ΔV_{SD}/ΔV_{GE}/ΔV_{CE}/ΔV_F

0000mV~1999mV

【DIODE】V_{P1}/V_{P2}

0.000V~4.000V(Read only on PC [PCでのみ検出])

【ΔV_F(PW-const)】IF

000.0A~102.3A(Read only on PC [PCでのみ検出])

TH1/TH2

000.0°C~300.0°C(Read only on PC [PCでのみ検出])

SETTING RANGE

MEASURABLE DEVICES

MOS FET, IGBT, DIODE (ΔV_F, ΔV_F(PW-const))V_{DS}/V_{CE}

1V~199V

I_D/I_C/I_F

0.010A~99.900A

I_M

1mA~199mA

GATE LIMIT(GL)

1.0V~19.9V

POWER FORCING TIME(PT)

100μs~300s

DELAY TIME(DT)

10μs~300s

LOWER GATE(LG)/UPPER GATE(UG)

0000mV~1999mV

BINNING

OPEN/SHORT CHECK

V_{F1} > 4V...OPEN V_{F1} < 0.2V...SHORT

BIN INDICATION

PASS, LOW, HIGH, AVAL/REJECT

DIMENSIONS & WEIGHT

MAIN UNIT

550(W)×1060+Safety cover 435(D)×1750(H) ...285kg

Self-Check Function (自己診断機能)

ソフトウェアを使用し自己診断を行うことができます。

電圧や電流を設定し、測定器内で値を読み取ります(自己診断時は測定端子部に電圧および電流が出力されますのでデバイスを取り外す必要があります)。

また、検出値に対して上限、下限を設定することができます。

- ① V_{DS} Voltage
- ② I_D/I_F Current
- ③ I_M Current
- ④ V_F Detect

Bias-Check Function (バイアスチェック機能)

測定中の電圧や電流値を読み取ります。

- ① V_{DS} Voltage
- ② I_D/I_F Current
- ③ I_M Current